

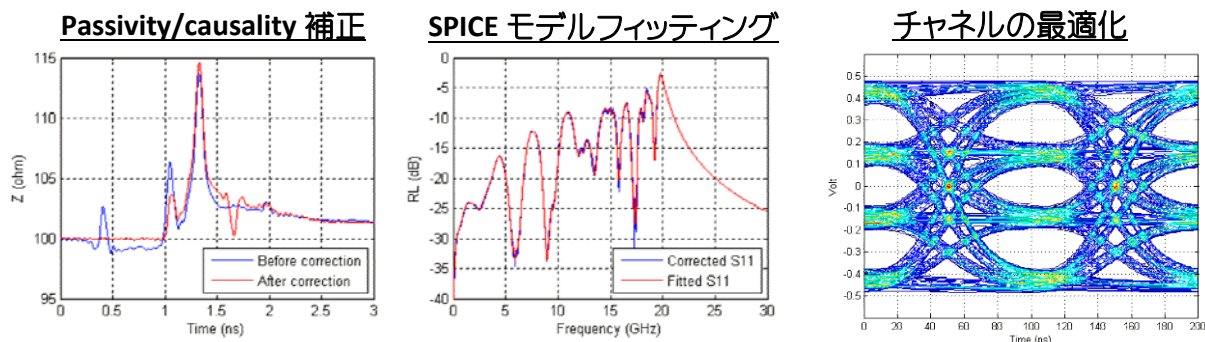
## マイクロエーブ展 2015 出展のお知らせ

ビフレストック株式会社は、2015年11月25日～27日にパシフィコ横浜で開催されるマイクロエーブ展 2015において、ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社様ブース(ブース No. A09)にて、米国 Ataitec 社の高周波/高速デジタル信号設計支援ソフトウェア「Advanced SI Design Kits (ADK)」並びに「In Situ De-embedding (ISD)」の展示を行います。

当日は、ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社様のベクトルネットワークアナライザ上で、ADK 及び ISD を動作させるデモンストレーションも行いますので、ご興味をお持ちの方は、是非、お気軽にお立ち寄りください。

### 【 Advanced SI Design Kits (ADK) 】

ADK は 28 種のデータ変換を行える、高周波/高速伝送設計向けの支援ツール群です。回路シミュレータを使用せず、タイムドメイン/周波数ドメインのデータの変換・補正・表示等が可能です。



### 【 In Situ De-embedding (ISD) 】

ISD は、被測定物を含む搭載治具全体の測定データから、ディエンベディングを行い、被測定物のみ S パラメータデータの抽出を非常に簡単な操作で行えるソフトウェアです。

#### 【主な特徴】

- ・被測定物を含む搭載治具全体のデータと、搭載治具の線路部分のスルーデータのみで、抽出ができるため、簡便です。
- ・被測定物だけのデータと同時に、被測定物を除いた搭載治具のデータが得られます。
- ・ディエンベディングの際に、S パラメータは時間軸でも最適化が図られ Passivity/Causality を満足する結果が得られます。
- ・一般的な TRL 法等の手法に比べ、簡便かつ精度よく被測定物のデータを抽出することができます。

#### 【上記に関するお問合せ】

ビフレストック株式会社

担当：新事業企画室 太田 (Tel; 03-3288-5271 )

(URL: [www.bifrostec.co.jp](http://www.bifrostec.co.jp)) トップページ「お問い合わせ」からお問い合わせください。